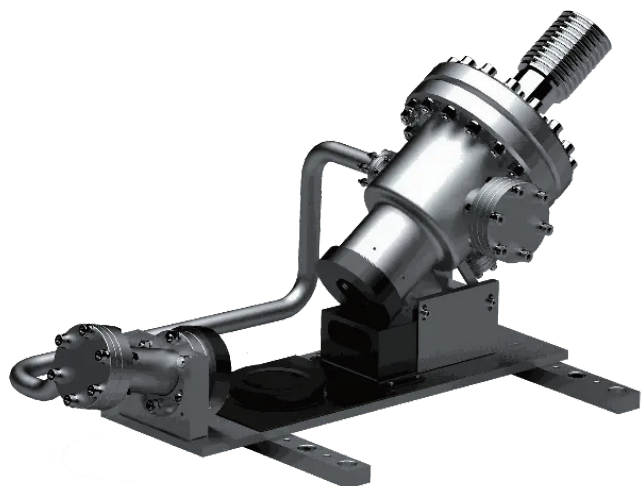


fastmicro

高真空落尘颗粒实时监控仪(PFS)

技术参数手册



生产过程中的一致性测量

- ① **快速:** 秒级连续监测
- ② **定量:** 适用于生产与研发环境的验证与监测
- ③ **操作简便:** 操作员简单培训即可使用
- ④ **精准:** 高分辨率测量(数量、时间线、位置、尺寸)
- ⑤ **一致性:** 可重复的客观测量结果
- ⑥ **高通量:** 现场实时分析

监测颗粒沉降速率(DPRL)

Fastmicro 高真空落尘颗粒实时监控仪(PFS)采用紧凑的工业设计,根据 ISO 14644-17,监测颗粒沉积速率(DPRL)。它通常用于真空环境中的过程监测。

监测仪也可作为系统集成商的白标模块集成到设备中。

结合我们易于使用的软件,我们帮助客户查看表面的清洁度测量值,而不仅仅是空气中的。并非所有颗粒都会留在空气中,因为它们可能会沉积在关键位置表面上,影响技术清洁度。

在关键区域实现持续监测

Fastmicro 高真空落尘颗粒实时监控仪(PFS)提供以秒为间隔的连续颗粒沉积速率监测。从 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 的颗粒开始,可以精确测量颗粒沉积速率。

使用高真空落尘颗粒实时监控仪(PFS),实际沉积速率变得清晰,可用于进一步提高清洁度。

Fastmicro 致力于帮助客户解决亚微米级洁净度检测的难题。我们相信,通过快速、精准、量化的表面颗粒测量,能帮助您实现洁净控制的技术突破。

我们的解决方案可以帮助工艺工程师精准决策工艺优化方向,持续交付高质量产品,最终为终端用户提供卓越性能的设备。

技术规格

高真空落尘颗粒实时监控仪

高通量检测	以秒为间隔连续监测表面上的颗粒沉积
数据输出及可视化	- 分析: 颗粒的数量、时间戳、位置和大小 - 颗粒物增量分析监测 - 颗粒检测结果标注图 - 报告: 导出功能 (支持 KLARF 及 .csv 文件, 包含标准分档尺寸) - 符合 ISO 14644-9 与 14644-17 标准的检测报告 (支持 UI 界面与 PDF 格式)
操作便捷	智能自动化操作
检测范围	- 颗粒尺寸: 粒径 $\geq 0.5\ \mu\text{m}$ (标准 PSL 颗粒, NIST 认证) 90% 累积颗粒计数 $\geq 0.5\ \mu\text{m}$ PSL 等效颗粒 (NIST 认证) - 可视范围为直径 1 英寸 (25毫米), 对应直径为 2 英寸 (50毫米) 的可更换表面
适用性	- 支持高达$10\text{e-}7$的真空环境 - 需要主动外部空气冷却 - 支持一站式工作流与深度分析
尺寸	525 x 335 x 260 mm (长x宽x高)
型号	FM-PS-VFS-V01

复纳科学仪器(上海)有限公司

